激光模拟单粒子效应测试系统

Laser Simulation Single Event Effects Testing System



LaPsee - I

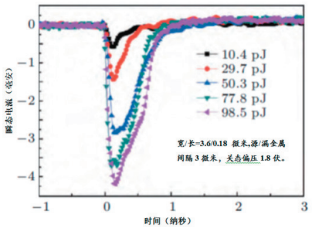
主要技术与性能指标

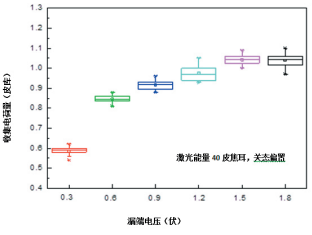
- 脉冲宽度（FWMH）：<25 ps
- 3σ 稳定性：<10%
- 光斑大小：1.2 μm@532 nm、1.4 μm@1 064 nm

主要应用

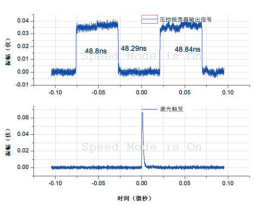
用于模拟空间粒子对电子元器件的影响，为电子元器件抗单粒子性能评估及加固技术提供测试方法

代表性应用成果

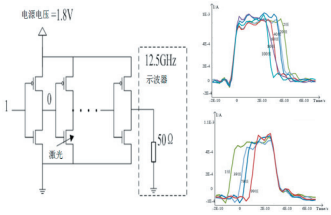




超快单粒子瞬态脉冲直接测量研究



模拟电路宽度变化测量



180 nm SOI 电路单粒子瞬态宽度测量

主要用户单位	中国空间技术研究院、中国电子科技集团、西安电子科技大学，以及中国科学院部分研究所
研制单位	中国科学院微电子研究所
联系方式	倪涛　010-82995976，13488665816　nitao@ime.ac.cn